

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC  
747-5

1992

AMENDEMENT 2  
AMENDMENT 2

1995-04

---

---

Amendement 2

**Dispositifs à semiconducteurs**  
Dispositifs discrets et circuits intégrés

**Cinquième partie:**  
Dispositifs optoélectroniques

Amendment 2

**Semiconductor devices**  
Discrete devices and integrated circuits

**Part 5:**  
Optoelectronic devices

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

J

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47C: Dispositifs opto-électroniques, d'affichage et d'imagerie du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteur.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
47C(BC)31	47C/91/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 4

## SOMMAIRE

Chapitre III: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

*Ajouter, à la page 10, le titre de la section 12 suivant:*

**SECTION DOUZE: INSPECTION VISUELLE DES CELLULES D'AFFICHAGE  
À CRISTAUX LIQUIDES MONOCHROMES**

Page 64

Chapitre III: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

*Ajouter, à la page 122, la section 12 suivante:*

**SECTION DOUZE: INSPECTION VISUELLE DES CELLULES D'AFFICHAGE  
À CRISTAUX LIQUIDES MONOCHROMES**

### 1 Domaine d'application

La présente section s'applique aux cellules d'affichage à cristaux liquides monochromes. Elle ne s'applique pas aux cellules d'affichage à cristaux liquides à matrice active.

## FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 47C: Optoelectronic, display and imaging devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
47C(CO)31	47C/91/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 5

## CONTENTS

Chapter III: Essential ratings and characteristics

*Add, on page 11, the title of section 12 as follows:*

### SECTION TWELVE: VISUAL INSPECTION OF MONOCHROME LIQUID CRYSTAL DISPLAY CELLS

Page 65

Chapter III: Essential ratings and characteristics

*Add, on page 123, the following section 12:*

### SECTION TWELVE: VISUAL INSPECTION OF MONOCHROME LIQUID CRYSTAL DISPLAY CELLS

#### 1 Scope

This section applies to visual inspection of monochrome liquid crystal display cells. This section does not apply to active matrix liquid crystal display cells.

## 2 Généralités

Les critères d'acceptation de spécimens soumis à l'inspection visuelle dépendent:

- de la dimension et du mode opératoire du dispositif;
- de la dimension, du nombre et de la position des pixels;
- du type d'application;
- du domaine de température;
- de la sévérité de l'inspection.

A cause de ces facteurs, il n'est en général pas possible de spécifier ces critères, référence est donc faite aux spécifications particulières et à des échantillons de référence.

NOTE – L'inspection est effectuée sur des afficheurs sans film de protection, soit à l'oeil nu, soit par un dispositif d'essai automatique.

## 3 Inspection visuelle des afficheurs

### 3.1 Afficheur non activé

#### 3.1.1 Conditions d'essai à spécifier dans la spécification particulière:

- cône de visibilité;
- éclairage externe ou à travers le dispositif (selon l'application);
- durée;
- distance d'observation;
- température ambiante.

#### 3.1.2 Procédure

Les dispositifs doivent être examinés pour rechercher les défauts visibles suivants:

<i>Défaut</i>	<i>Critères de rejet</i>
Taches (voir figure 1), bulles, particules étrangères	A spécifier dans la spécification particulière
Traces claires ou sombres sur fond clair	A spécifier dans la spécification particulière
Traces claires ou sombres sur fond sombre	A spécifier dans la spécification particulière
Eraflures sur la cellule à cristal liquide et sur le polariseur à l'intérieur du cône de visibilité préférentiel	A spécifier dans la spécification particulière
Détérioration mécanique en dehors de la zone d'observation (voir figures 3 et 4)	A spécifier dans la spécification particulière
Cumul de défauts visibles des types ci-dessus	Echantillons de référence